



大连高新技术产业园区汇贤园 7 号 1 层#01-02 室

报价人：刘俊学 15542558756

报价时间：2023 年 3 月 20 日（有效期 60 天）

TO：松山湖实验室

报价单

碳化硅外延片晶圆少子寿命成像系统

型号：SICMAPPING-1064

Item	Model & Description	Qty.	价格
1	<p>一、设备介绍</p> <p>该采用全新超快光谱成像技术，利用高速相机实现载流子衰减动力学的成像，无需扫描样品，检测速度大幅提升。</p> <p>二、主要技术参数</p> <p>1、激发波长:355nm</p> <p>2、IRF:<15ns</p> <p>3、空间分辨率:最高 0.1mm</p> <p>4、探测波长:1064nm</p> <p>5、扫描时间(每片):无图形<5 min; 快扫<10min;>精扫< 25min</p> <p>6、探测器:高速相机</p>	1	130 万
2	<ul style="list-style-type: none">● 运费、安装、调试● 质保：3 年	1	包含
		总价：	140 万
		折扣价：	98 万



碳化硅 (SIC) 晶圆质量成像检测系统



- 高速成像
- 高空间分辨率
- 外延层载流子寿命精确测量
- 可切换的激发波长，用于体相和表面检测

主要技术指标

时间分辨率	< 5 ns (IRF 15ns)
空间分辨率	100 μ m (整片晶圆检测)
成像速度	5~25 minutes / wafer (typ.)
激发波长	355/266 nm可切换的激发波长
晶圆尺寸	4" /6" /8"
时间窗口	50ns~20ms 可调
拓展功能	可实现表面和体相寿命成像检测 可兼顾光学明场成像，实现外观样品成像检查 可兼顾荧光检测，实现缺陷探测和成像

检测实例1

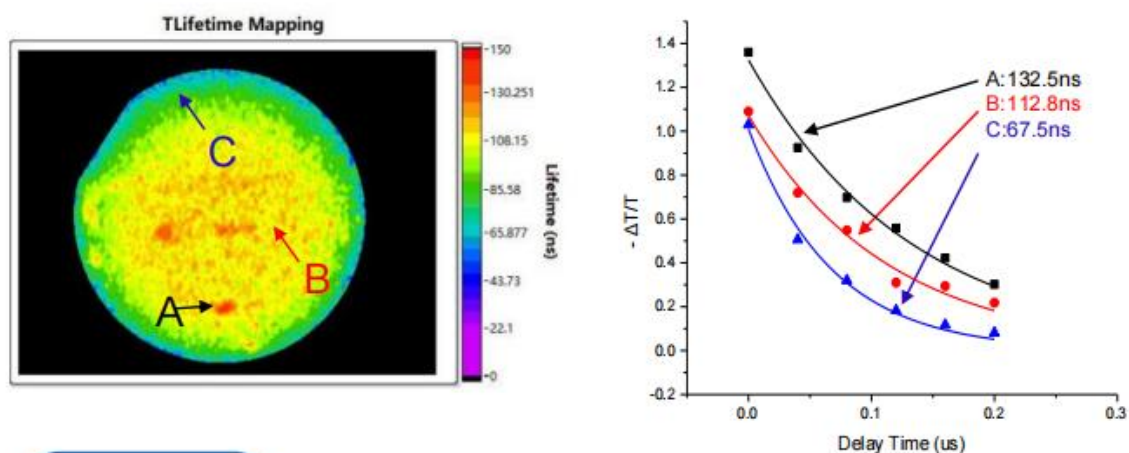
外延片厚度: 11 μ m

检测时长: 22min

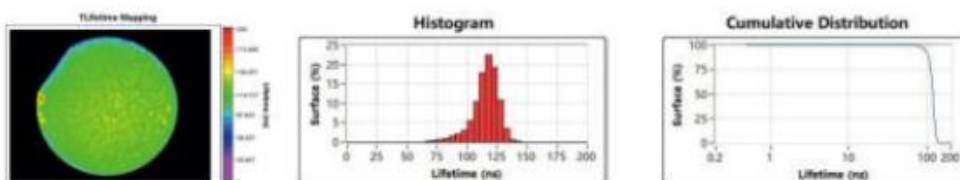
空间精度: 0.1mm

平均寿命: 97.7ns

寿命偏差: 15.6%



检测实例2



Test Information		Lifetime	
Date	//	Average	115.0208 ns
Operator		Median	116.5851 ns
Sample		Deviation	9.955%
Size		Minimum	37.0240 ns
Pixel		Maximum	178.6903 ns
Spatial Resolution		Time Window	0.700 us

Email :
sales@timetechspectra.com

联系电话
+86-15642378784

网站
www.timetechspectra.com

地址:
辽宁省大连市高新技术产业园区腾飞园区二期101-102#